

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Trabajo Practico N° X
Aaaaa Bbbbb Ccccc Ddddd

Cátedra de Xxxx, Departamento de Ingeniería Electrónica

Profesor:

Estudiantes: Vatcoff, Mariano 76.771
Aaaaaa, Bbbbb XXXX

Curso: 5R1

Fecha: 28 de junio de 2022

Índice

1. Marco Teórico	3
2. Sección 1	4
3. Sección 2	5
4. Sección 3	6
5. Sección 4	7
6. Sección 5	8
7. Conclusiones	9

Introducción

1. Marco Teórico

2. Sección 1

Esto es una referencia a la figura 1

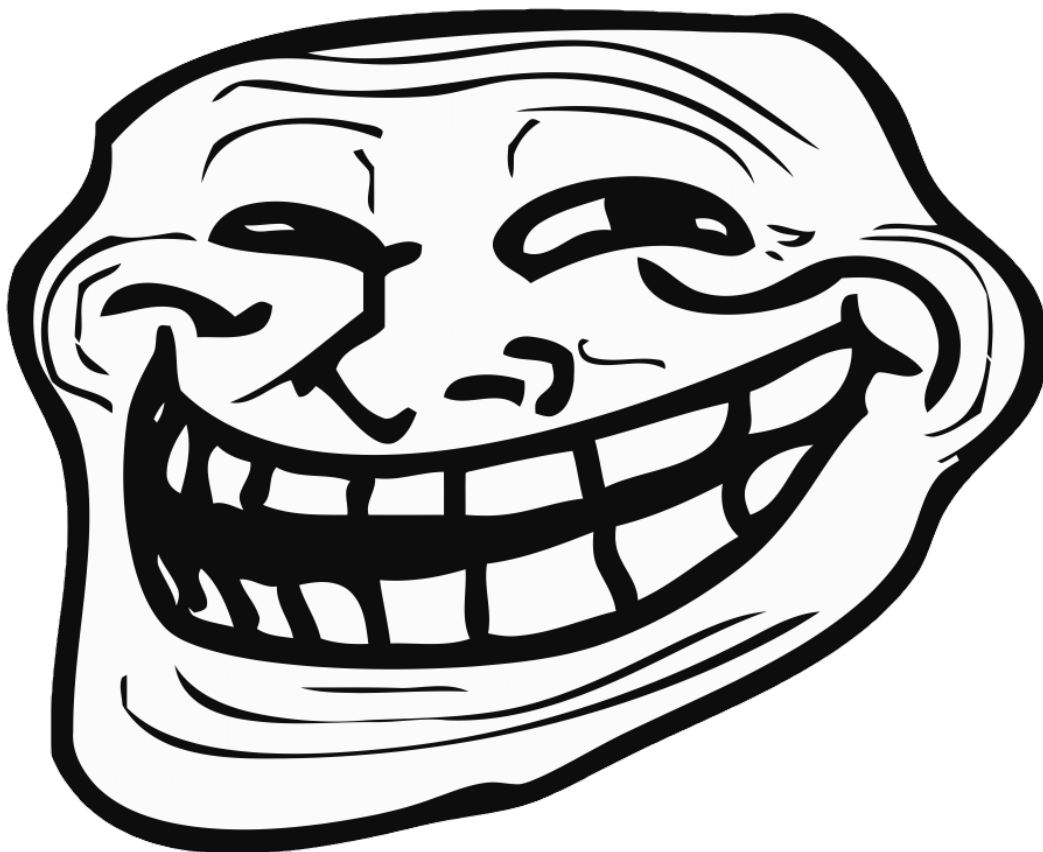


Figura 1: Troll Face

Esto es una referencia a la bibliografía [1]

3. Sección 2

4. Sección 3

5. Sección 4

6. Sección 5

7. Conclusiones

Referencias

- [1] Mark White and Joseph B. Bernstein. *Microelectronics Reliability: Physics-of-Failure Based Modeling and Lifetime Evaluation*. NASA JPL Publication 08-5 2/08, 2008.